



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种SOI MOS器件闪烁噪声的测试设备及测试方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201410031166.X
申请日期:	2014-01-23
专利号:	201410031166.X
第一发明人:	李书振;卜建辉;毕津顺;曾传滨;罗家俊;韩郑生
实施情况:	授权
专利证书号:	201410031166.X
其它备注:	硅器件中心

